Junitreffen 2016 zum NWAT, IMP Leibniz Universität Hannover, 24. Juni 2016

Vorstellung Kurzprofil Verbundzentrum für Oberflächenund Mikrobereichsanalyse VOM Münster

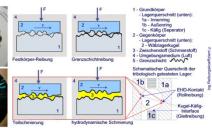
designierte Mitwirkung:

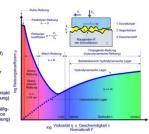
- assoziierte Netzwerkpartnerschaft -

















Junitreffen 2016 zum NWAT



Verbundzentrum für Oberflächenund Mikrobereichsanalyse VOM Münster

Das Verbundzentrum für Oberflächen- und Mikrobereichsanalyse (VOM) wurde 1987 auf Initiative des Landes NRW und führender Hochschulwissenschaftler gegründet. Aufgabe war es, der Industrie einen geregelten Zugang zu Großgeräten der Oberflächen- und Mikrobereichsanalytik zu verschaffen. 1992 wurde das VOM kommerzialisiert.









Verbundzentrum für Oberflächenund Mikrobereichsanalyse VOM Münster

Das Angebot reicht heute von dem einmaligen Analyseauftrag über Entwicklungs- und Produktionsprozessbegleitende Analysen bis zur Erarbeitung von Analysemethoden zur Qualitätssicherung und Prozessoptimierung.









Verbundzentrum für Oberflächenund Mikrobereichsanalyse VOM Münster

Für die Behandlung tribologischer Fragestellungen bietet das VOM die klassischen Methoden der Oberflächenanalytik und der Mikroskopie an, wie etwa ToF-SIMS, XPS, REM/EDX und AFM.

Daneben hat das VOM Zugriff auf weitere etablierte und weniger etablierte Analysemethoden.







Die wichtigsten Verfahren sind im Folgenden aufgelistet nach *Einsatzbereichen:*



Bestimmung der Elementzusammensetzung:

EDX (Energy dispersive X-ray Analysis)
XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)
ToF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)

Chemische Zusammensetzung:

ToF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)
XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)
ICP-MS (Inductively coupled Plasma Mass Spectrometry)

Mechanische Eigenschaften:

AFM/SFM (Atomic/Scanning Force Microscopy)







Junitreffen 2016 zum NWAT

Die wichtigsten Verfahren sind im Folgenden aufgelistet nach *Einsatzbereichen:*



Topographie:

SEM (Scanning Electron Microscopy)
OP (Optical Profiling)
AFM/SFM (Atomic/Scanning Force Microscopy)

Schichtaufbau:

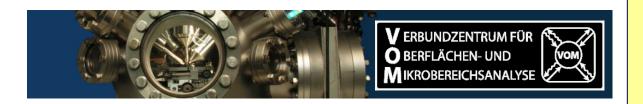
SNMS (Secondary Neutral Mass Spectrometry)
ToF-SIMS (Time-of-Flight Second. Ion Mass Spectrometry)
XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy).







Kontaktdaten:



Telefon: +49-251-2101.560

+49-251-2101.561

E-Mail: info@vom-muenster.de

Telefax: +49-251-2101.562

Internet: www.vom-muenster.de

postalische Adresse:
VOM
Wilhelm-Klemm-Str. 10
48149 Münster



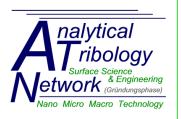




Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

Mehr Informationen zum VOM im Kontakt oder bei einer eigenen Vorstellung des VOM.

– VOM – Herzlich Willkommen in den Vorhaben zum Netzwerk AT!



Gründungsinitiative

Interdisziplinäres wiss.-techn. Kompetenznetzwerk
Analytische Tribologie

info@analytical-tribology.eu | www.analytical-tribology.net









Junitreffen 2016 zum NWAT